报告

微小阻抗测量

实验目的

- 学习使用锁相放大器
- 精确测量某一个元件或线路的微小阻抗及分离其纯电阻分量

实验材料

• 实验对象

可调节板间隔(变化)的平行板电容和变容二极管电容随偏置电压的变化。

• 待测器件

平行板电容

- 仪器用具
 - 平板电容器
 - 变容二极管
 - D6251863 双通道锁相放大器
 - 示波器

•

数据文件格式

(表格详见 数据记录 部分)

桌号: B3

LIA: D6251863,双通道

实验方法: 分压法测微小电容变化

面包板接触电阻太大

报告包含所搭建的测量单元的实物照片

微小阻抗测量原理

微小阻抗:微小感抗、微小容抗、微小电阻,阻值在微欧量级。在很多场合,更需要测量的是电阻、或电感、或电容的微小变化。

- 电流通过微小热敏阻抗或者热敏阻抗自身变化引起的压降比较小,SNR↓。我们使用LIA测量之。
- 容感元件在不同频率下的阻抗也不同,分布的、极小的电容影响精密测量 先明确结果影响因素:
- 引线
- 接触电阻
- 内阻
- 接触点温差电势

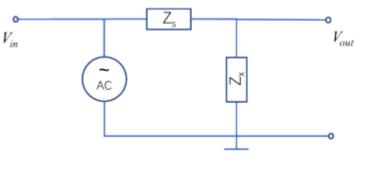
分压法测量

选择理由:分压法的噪声相比于四引线法更小。

微小电感

$$ilde{Z}_L=j\omega L, Z_R=R$$

所以同时考虑低频下的电阻和电感的微小测量.对于一个标准的R,C串联电路:



$$egin{aligned} ilde{V}_{out} &= rac{Z_X}{Z_S + Z_X} ilde{V}_{in} = rac{r_x + j\omega L_x}{r_s + r_x + j\omega L_x} ilde{V}_{in} \ & rac{V_{in} e^{i\omega t}}{r_s + r_x + j\omega L_x} = rac{V_{out} e^{i(\omega t + arphi)}}{r_x + j\omega L_x} \end{aligned}$$

$$egin{align*} V_{in} rac{r^2_{~x} + \omega^2 L_x^{~2}}{r_s^{~2} + r_x^{~2} + \omega^2 L_x^{~2}} (r_s + r_x + j\omega L_x) &= V_{out} \left(r_x \cos arphi + \omega L_x \sin arphi - \omega L_x \cos arphi
ight) \ & ext{Re} \left\{ Left
ight\} &= ext{Re} \left\{ Right
ight\}, ext{Im} \left\{ Left
ight\} &= ext{Im} \left\{ Right
ight\} \ &\Longrightarrow \ r_x &= rac{V_{out} \left(r_s \cos arphi - \omega L_x \sin arphi
ight)}{V_{in} - V_{out} \cos arphi} \end{split}$$

 Z_X 为纯电阻,则 $L_X=0, arphi=0, r_x=rac{V_{out}}{V_{in}-V_{out}}r_s$

测微小电容

$$C_X = rac{V_{out}}{V_{in} - V_{out}} C_0$$

可以得到待测电容。

分压法的输出电压进入锁相放大器, 能够得到时变的小阻抗信号。由于LIA的在低频段效果不甚理想,于是我们必须考虑低频下的本底的消除。

固定平行板间距,改变流经板间的介质的浓度。在测量电容时,用OE1022D双通道锁相放大器提供信号源作为 V_{in} 进入电路,经过变压器提压和直流隔离,加到测量电路,再将 V_{out} 输入到锁相放大器。

- 耦合: 此处是信号的叠加
- 阳抗匹配: 在此实验中, 低频信号可以忽略反射。但要考虑到变压器处的阻抗匹配。
- 直流耦合: 保证直流交流都能通过
- 交流耦合: 滤去直流

实验步骤

- 测量小电容及其变化
 - 1. 在教学实验箱上连接待测电容,如变容二极管、或自制电容(如可调间距的平板电容、 双绞线电容等);
 - 2. 按实验方案连线示意图对教学实验箱与锁相放大器接线:包括锁相放大器信号输出、输入,反偏直流电压点 DC-Vt 电位测量(查 OE1022 说明书,注意单通道与双通道锁相放大器的不同。)
 - 3. 设置参考信号频率与振幅;
 - 4. 电缆连接后拍照, 且锁相放大器的外部输入的参考信号不得小于150mV
 - 5. 小心缓慢调节教学实验箱上的电位器,扫频使得变容二极管的反偏直流电压DC-Vt 从1至 7.9V 逐渐变化,变化步长为 0.2V,逐点记录 DC-Vt 和锁相放大器 R 值;
 - 6. 记录测量值,结束后利用(D1-55)式计算二极管电容,并作 DC-Vt 的曲线关系图。

3. $C_x = rac{Vout}{V_{in} - V_{out}} C_0$

如图所示,用教学实验箱给二极管加偏置电压,用OE1022提供信号源(式中的 V_{in} 为SINE OUT信号发生器输出信号,经实验箱变压器提压以及直流隔离,加载测量电路上;式中的 V_{out} 为输入锁相放大器 $signal_{in}$ 的信号,即 V_{out} 是OE1022测得值幅值R, $C_0=6.8nF$

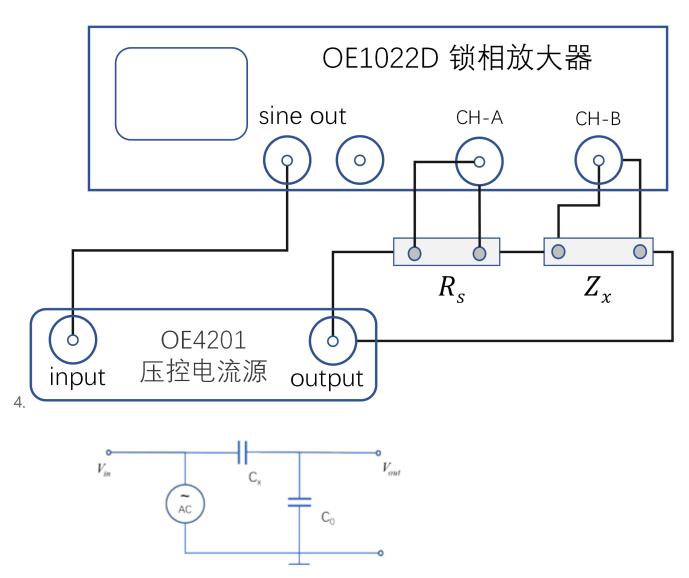
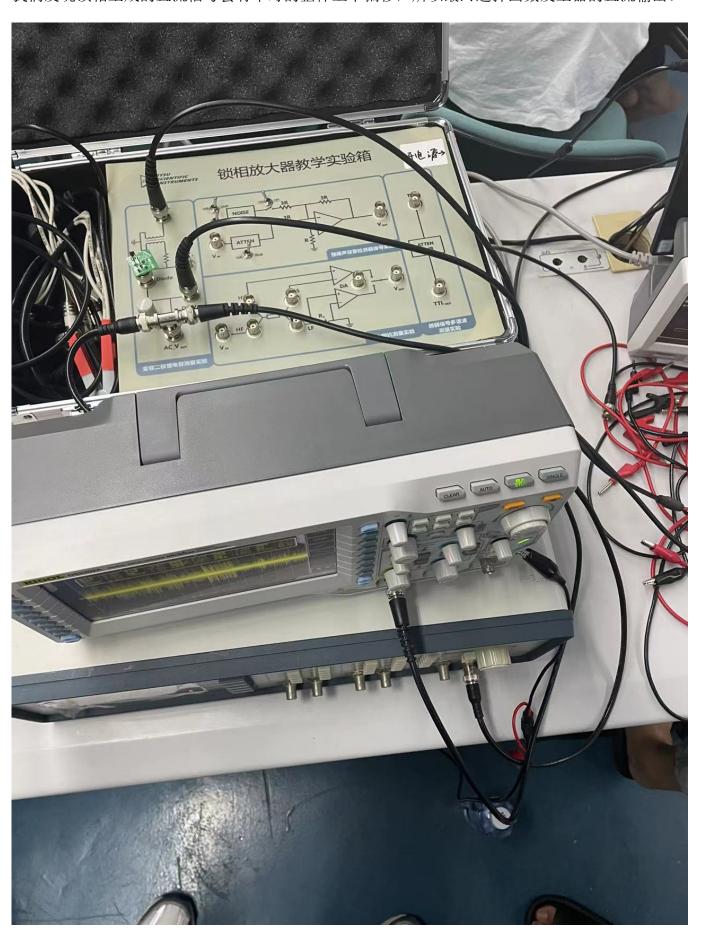


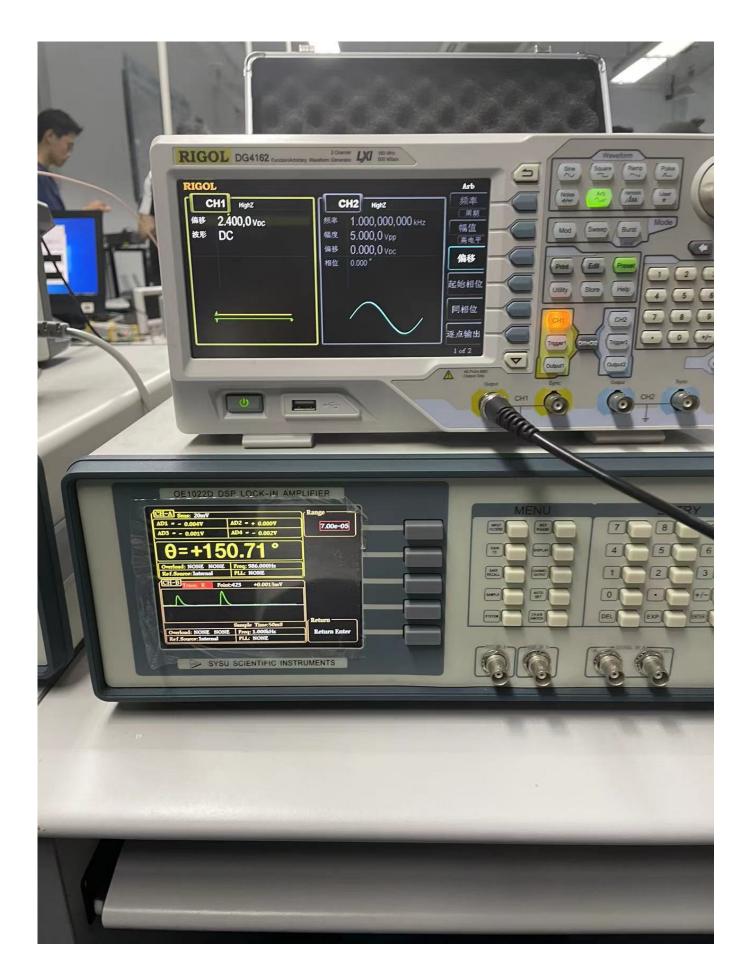
图 D1-37 变容二极管结电容测量实验原理图简图

数据记录

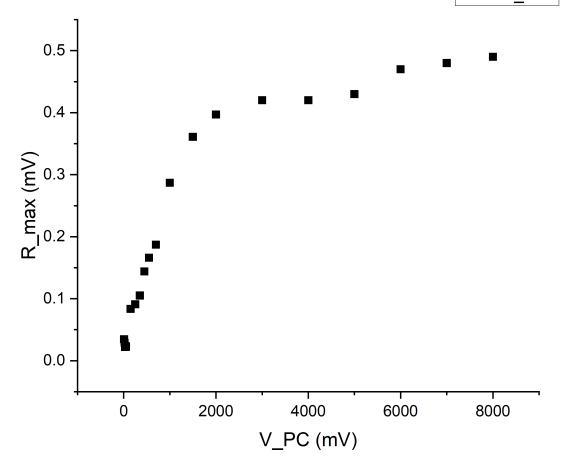
```
Sens = ImV
测量。
       10
       40
       50
                   ((Sens-30mV) 3//10/2022
      250
             0-105
      350
      450
             0.144
             0-166
      IJO
             0.187
      700
                                       加瑟型
             0.236,0.287
      1,500
      3k
            0.42
      4K
      510
            vista43 senc: loomV
      6K
      7K
             0.49
       8k
```

实验中,小组发现可以通过**TUX**接口来让双通道锁相放大器输出直流信号,但经过比较,我们发现锁相生成的直流信号会有不时的整体上下偏移,所以最终选择函数发生器的直流输出。





首先整理数据,得到初步的 $R_{max} - V$ 图像



我们测量到 R_{max} 为经过LIA处理过的 V_{out} , V_{pc} 为其反向偏压在不考虑电容的情况下,我们进行拟合: $EC_x = rac{V_{out}}{V_{in}-V_{out}}C_0 = \lambda C_0$ 中

$$\lambda = rac{V_{out}}{V_{in} - V_{out}} = (-)rac{1}{1 - rac{V_i}{V_o}} = -rac{1}{1 - rac{v}{v_D}}$$
 $\lambda_1(V_{pc}) = 0.002V_{pc}^{-3.1648}$

Vout / (Vin - Vout) Allometric1 Fit of Sheet1 C Allometric1 Model y = a*x^b Equation 0.0006 Vout / (Vin - Vout) 0.00204 ± 4.50115E-4 Vout / (Vin - Vout) -0.31648 ± 0.03813 Reduced Chi-Sqr 3.60957E-9 0.84978 R-Square (COD) 0.83905 Adj. R-Square 0.0004 0.0002

6000

思考题

测量微小电阻思考题

0

2000

$$C_x = \frac{V_{out}}{V_{in} - V_{out}} \tag{A}$$

8000

1. 对于电流(纯电阻压降),电容的压降为虚部,在推导(A)式时,为何没有考虑虚部的贡献? 首先,我们先导出:

4000

V PC

$$egin{aligned} ilde{Z}_C &= rac{1}{j\omega C} = -jrac{1}{\omega C} \Longrightarrow \ V_{out}e^{i(\omega t + arphi)} &= V_{in}e^{i\omega t}rac{rac{1}{\omega C_0}}{rac{1}{\omega C_0} + rac{1}{\omega C_X}} = V_{in}e^{i\omega t}rac{C_X}{C_X + C_0} \ &rac{C_X + C_0}{C_X} &= rac{ ilde{V}_{in}}{ ilde{V}_{out}} \Longrightarrow C_X = rac{C_0}{rac{ ilde{V}_{in}}{ ilde{V}_{out}} - 1} = C_0rac{ ilde{V}_{out}}{ ilde{V}_{in} - ilde{V}_{out}} \end{aligned}$$

由于电路简图中,我们并入了一个电容,又串如一个电容,所以对单电容造成的相差有了抑制效果。于是可以有:

$$arphipprox 0 \implies C_0rac{ ilde{V}_{out}}{ ilde{V}_{in}- ilde{V}_{out}} = C_0rac{V_{out}}{V_{in}-V_{out}}$$

- 2. OE1022的输入阻抗为10MΩ,等效电容为 25~30pF(见手册),请在简化模型(图 D1-37 的原理图)的基础上画出等效电路(提示如图 D1-43);并且,分析忽略它会造成的误差 有多大? 是属于什么误差?
- 3. 定量分析反偏直流电压与二极管结电容的关系,并通过拟合(D1-61)式,判断所测的PN 结是哪种结:

$$C_j(v) = rac{C_{j0}}{(1-rac{v}{v_D})^{\gamma}}$$

其中, C_{j0} 为偏置电压为零(V=0)时的结电容, γ 为电容变化系数,它的值随半导体的掺杂浓度和 PN 结的结构不同而异, V_D 为接触电势差。根据前面的拟合结果,测的是N结。